



Politechnika Lubelska
Biuro Zamówień Publicznych
20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40A
tel. +48 81 538 46 32, e-mail: bzp@pollub.pl

Pismo: KP-272-PNK-152/2020 - 615

Lublin dnia: 2020-12-16

**Uczestnicy postępowania
KP-272-PNK-152/2020**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa spektrofotometru UV-Vis, dwuwiązkowego, skanującego wraz z wyposażeniem na potrzeby Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Zamawiający, **Politechnika Lubelska**, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dokonuje wyjaśnień treści SIWZ poprzez udzielenie odpowiedzi na złożone zapytanie bez ujawniania jego źródła:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z gwarancją wynoszącą 1 rok, gwarancją na optykę wynoszącą 10 lat oraz gwarancją na lampę deuterową wynoszącą 1500 godzin pracy?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuści urządzenie z gwarancją wynoszącą 1 rok (jest to jedno z kryteriów oceny ofert pkt. 14 SIWZ).

Gwarancja na optykę nie była uwzględniona w Opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza gwarancji na lampę deuterową wynoszącą 1500 godzin pracy. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby gwarancja na lampę wynosiła 36 miesięcy.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez metody Kubelka-Munk w oprogramowaniu? Oprogramowanie posiada funkcje obróbki danych, umożliwia także zapis danych w różnych formatach otwieralnych w ogólnie dostępnych programach do obróbki widm. Pozwoli to na kompleksową analizę.

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuści urządzenia bez metody Kubelka-Munk.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści sferę integrującą pracującą w zakresie 380 – 1100 nm, o średnicy 75 mm, pokrytą Spectralonem, z możliwością wyłączenia składowej zwierciadlanej, korzystającą z detektora spektrofotometru?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuści sferę integrującą pracującą w zakresie 380 – 1100 nm, o średnicy 75 mm, pokrytą Spectralonem, z możliwością wyłączenia składowej zwierciadlanej, korzystającą z detektora spektrofotometru.

Zatwierdził
Kanclerz Politechniki Lubelskiej
/-/ **Wiesław Sikora**